

XRF仪器XRF测试仪XRF仪无卤测试X荧光光谱仪

产品名称	XRF仪器XRF测试仪XRF仪无卤测试X荧光光谱仪
公司名称	纳优科技（北京）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区白家疃尚峰园3号楼4层515
联系电话	86-075533625251 15899538701

产品详情

惠州XRF检测仪,深圳X射线光谱仪,东莞能量色散XRF

型号：NDA200

新品【免拆分】

详细参数欢迎来电咨询，电话：15899538701（徐生）QQ:806043286

应用领域

RoHS指令筛选检测

无卤指令筛选检测

玩具指令筛选检测

金属镀层测厚

合金成分分析

技术特点

配置最新专利技术“样品免拆分”检测模式：采用最新专利技术的光路结构，最小照射光斑直径可达到0.5mm，辅以精确的光斑定位系统，从而可以实现对复杂样品进行免拆分直接测量的要求

配置符合中国国家标准的样品混测功能：方形4mm 4mm光斑设计，配合0.5mm光斑配合使用，能够对电路板等复杂样品实现“免拆分”区域扫描测量功能；从而显著节省测量时间，大幅度提高检测效率

配置ON-Line实时在线技术支持系统（选配）：实时解决用户在使用过程中的疑难技术问题，同时对用户操作人员进行培训

配置十六组复合滤光片：NDA200型配置了16组复合型滤光片，是业界配置最全、数目最多的配置之一；16组滤光片的配置，极大的保证了XRF分析仪针对各种复杂样品检测的适应性

内置标准工作曲线：仪器内置了满足EU-RoHS以及CHINA-RoHS产品认证要求的基础材料的工作曲线，方便用户直接使用；并与国家指定的认证检测实验室保持一致

具备开放的工作曲线技术平台：基于开放的工作曲线技术平台，电子生产企业可以建立针对自己工厂特定物料的工作曲线，确保XRF分析仪检测结果的可靠性和准确性

分析软件操作系统分级管理：仪器系统软件配置了操作员、工程师两级操作功能菜单，便于工厂有序管理；操作员菜单简单直观，避免仪器重要参数的误修改；工程师菜单功能强大，仪器的各种参数设置权限全部开放给用户

采用经典的迷宫式辐射防护结构：采用了经典的迷宫式辐射防护结构，在保持仪器外形美观操作方便的同时，彻底杜绝低能散射X射线的泄露

可选配专利技术“影响权系数法”多层镀层测厚功能：纳优科技独创的“影响权系数法”多层镀层测厚技术，显著提高镀层厚度测量的准确度；最大可测量镀层数量为9层；彻底解决了常规XRF测厚方法所不能解决的塑料基体镀层厚度测量的技术难题

外观设计实用美观：符合人体工程学的仪器外形设计，操作人员测量过程方便舒适

分析方法及系统软件

分析方法配置：

基于蒙特卡洛计算模型的基本参数法

经验系数法

理论系数法

软件功能描述：

RoHS指令、无卤指令等环保指令所限制的Pb、Hg、Cd、TCr、TBr、Cl等元素含量的分析

各种金属材料、无机非金属材料（不包括聚合物材料）的材质分析（S~U元素）

聚合物等有机材料中硫（S）~铀（U）元素的含量分析

分析报告的自主定制与输出打印 分析结果的保存、查询及统计 On-Line实时在线技术支持与技术服务功能

多层镀层厚度测量功能（选配）

主要配置

美国Si-PIN电制冷半导体探测器

侧窗钼 (Mo) 靶管

标配16组复合滤光片

配置了 0.5mm、 1mm、 3mm、 4mm四种准直器

具备符合中国国家标准的样品混侧功能

内置标准工作曲线

配置On-line实时在线技术支持与服务平台

具备开放工作曲线技术平台

分析软件操作系统分级管理

产品参数

名称：X荧光光谱仪型号：NDA200输入电压：220 V 5V/50Hz消耗功率：≤500W环境温度：15-30℃环境湿度：≤80%（不结露）主机外形（mm）：长*宽*高=900*500*440样品仓（mm）：长*宽*高=430*380*120主机重量：约60公斤

技术指标

元素种类：元素周期表中硫（S）~铀（U）之间元素测量时间：对聚合物材料，典型测量时间为200秒对铜基体材料，典型测量时间为400秒检出限指标（LOD）：

对聚合物材料：LOD（Pb） 5mg/Kg；LOD（Hg） 5mg/Kg；LOD（TCr） 5mg/Kg；LOD（TBr） 5mg/Kg；LOD（Cd） 5mg/Kg对铜基体材料：LOD（Pb） 50mg/Kg精密度指标，以连续测量7次的标准偏差表征：对聚合物（塑胶）材料：LOD（Pb） 15mg/Kg；LOD（Hg） 15mg/Kg；LOD（TCr） 15mg/Kg；LOD（TBr） 15mg/Kg；LOD（Cd） 7mg/Kg对铜基体材料：LOD（Pb） 50mg/Kg准确度指标，以系统偏差进行表征对聚合物材料：（Pb） 100mg/Kg；（Hg） 100mg/Kg；（TBr） 100mg/Kg；（TCr） 100mg/Kg；（Cd） 10mg/Kg对铜基体材料：（Pb） 150mg/Kg

应用示例：膜厚测试